

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

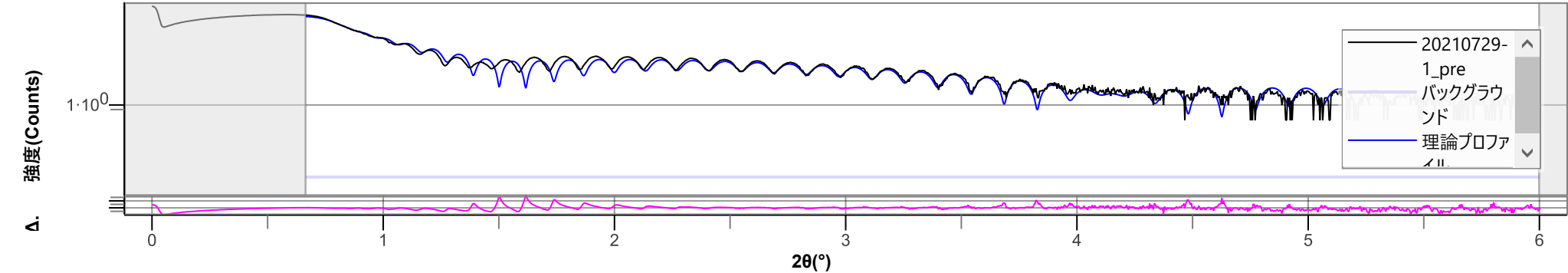
波長(nm): 0.1540593
点数: 1501
2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 9.27e-003

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg<		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.704	Const	2.47501	Const	0.187	Con...	
				±0.014	精密化	±0.04	最小ー精密化	±0.009	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	2.944	Const	4.90417	Const	0.100	Con...	
				±0.02	精密化	±0.03	ー最大精密化	±0.03	最小ー精密化	
	<input type="checkbox"/>	L3	Fe	0.000	Const	7.87400	Const	0.613	Con...	
				±0.8	最小ー精密化	±0.06	ー最大精密化	---	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	58.340	Const	7.87400	Const	0.219	Con...	
				±0.02	精密化	±0.05	ー最大精密化	±0.008	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	0.083	Const	3.93702	Const	0.317	Con...	
				±0.3	最小ー精密化	±0.1	最小ー精密化	±0.009	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	